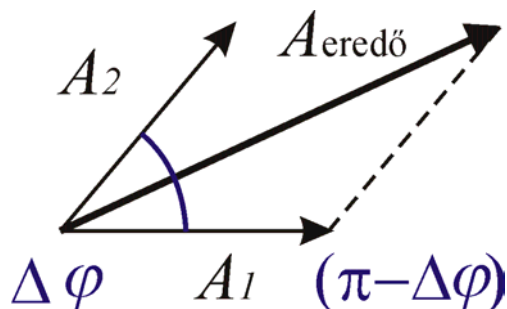


Szemünk nem az amplitúdókat, hanem a négyzetükkel arányos **fényteljesítményeket** (P) „érezeli”.

Mivel $A_{\text{eredő}}^2 \sim P_{\text{eredő}}$, és $A_{\text{eredő}} = A_1 + A_2$ ezért $P_{\text{eredő}} \neq P_1 + P_2$.

Két vektor (A_1, A_2) eredője ($A_{\text{eredő}}$), illetve annak négyzete, ha a köztük lévő szög $\Delta\varphi$:



$$P \sim A_{\text{eredő}}^2 = A_1^2 + A_2^2 - 2A_1 A_2 \cos(\pi - \Delta\varphi) \quad (\text{koszinusz tétel})$$

$$P \sim A_{\text{eredő}}^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos\Delta\varphi$$

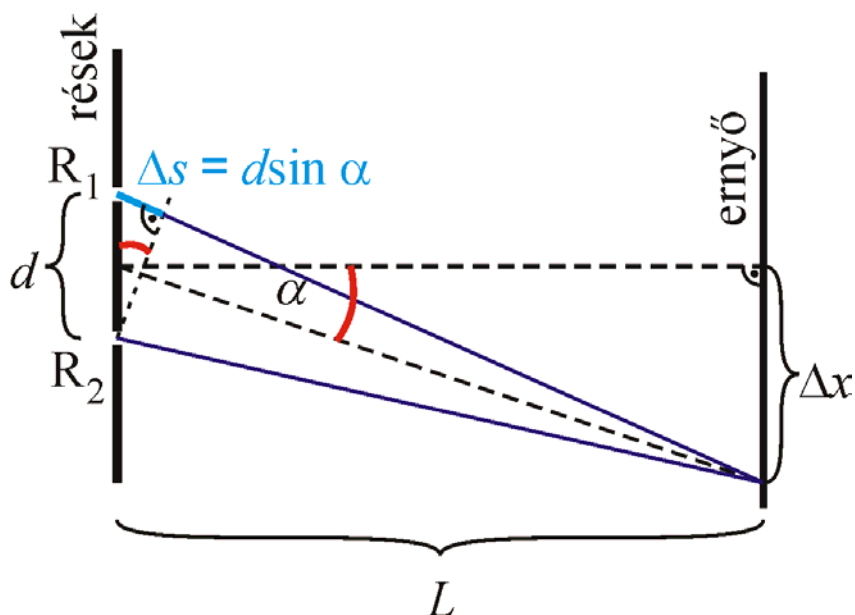
$$\text{Ha } A_1 = A_2 = A, \text{ akkor } A_{\text{eredő}}^2 = 2A^2 (1 + \cos\Delta\varphi)$$

A **fáziskülönbséget** ($\Delta\varphi$) az **útkülönbség** (Δs) és a **hullámhossz** (λ) viszonya szabja meg.

Ha $L \gg d$,

akkor az **útkülönbség**

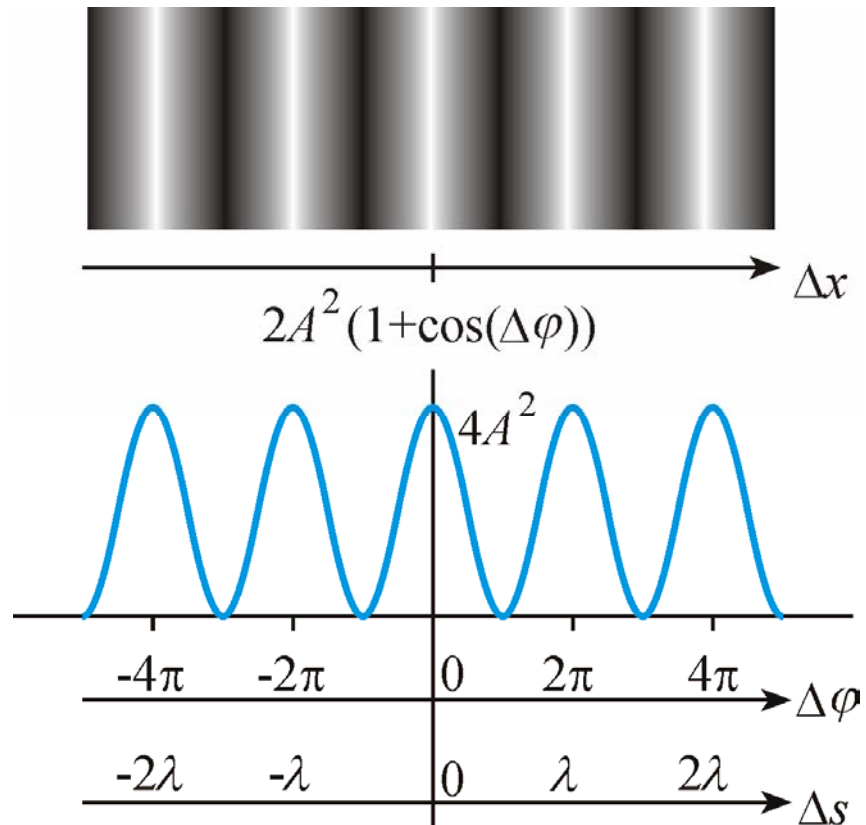
$$\Delta s = d \sin \alpha.$$



A **fáziskülönbség** pedig:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta s = 2\pi \frac{d \sin \alpha}{\lambda} \approx 2\pi \frac{d \Delta x}{\lambda L}$$

Szemléltetés:



Sok egyforma rés, vagyis **optikai rács** esetén nagyon **éles maximumok** figyelhetők meg a $\Delta\varphi = 2k\pi$ vagy $\Delta s = k\lambda$; $k = 0, 1, 2, \dots$ feltételnek megfelelő helyeken.

$$2k\pi = \Delta\varphi \approx 2\pi \frac{d\Delta x}{\lambda L}$$

L és Δx makroszkopikusan mérhető, így ha λ ismert, akkor a mikroszkopikus d meghatározható, tehát általánosságban:

a makroszkopikus elhajlási képből mikroszkopikus adatokat nyerhetünk.

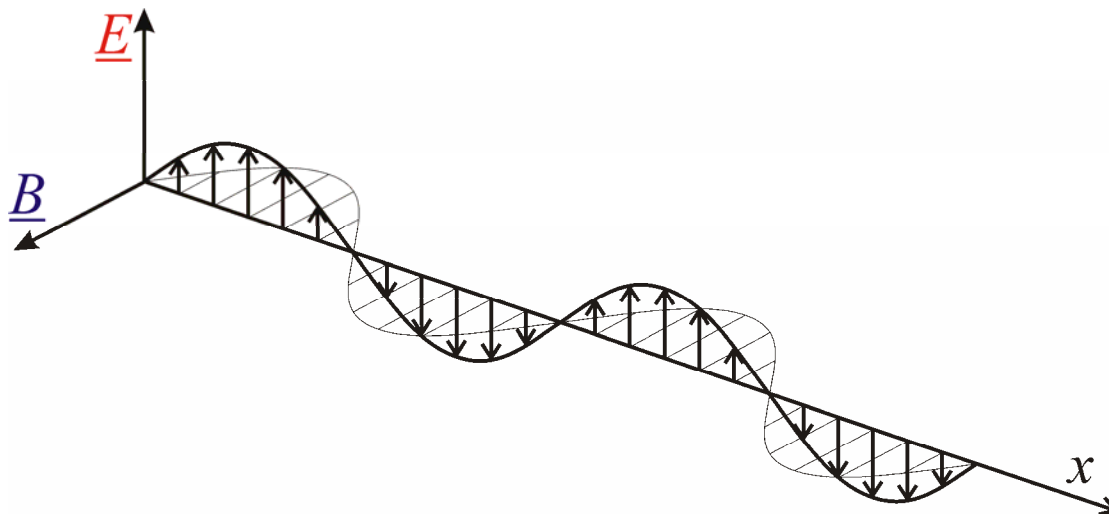
Alkalmazások: a mikroszkópok feloldóképességének meghatározásánál,
de ez az alapja minden diffrakciós módszernek is
(röntgen diffrakció; **fehérje szerkezet vizsgálat**)

A fény elektromágneses hullám

transzverzális

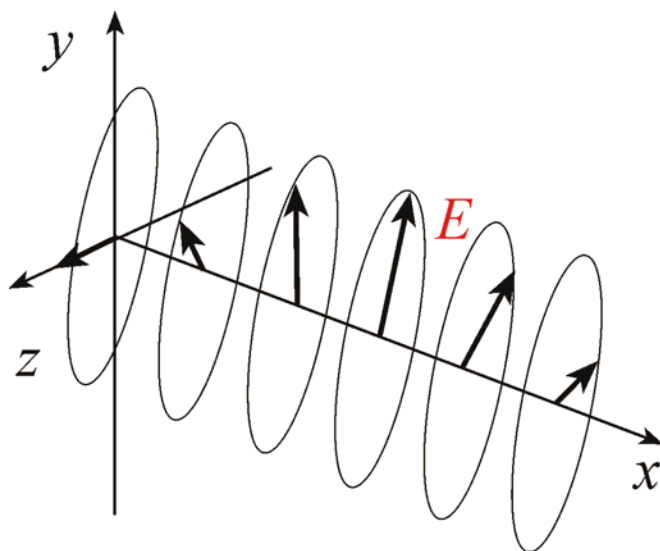
ezért polarizálható

lineárisan polarizált fény
vagy síkban polarizált fény



De van

elliptikusan polarizált fény is.



Optikai anizotropia

Pl. „anizotrop anyagban” a megfelelően módon lineárisan polarizált fény terjedési sebessége függ a terjedés irányától. Ennek oka az anyag struktúrájával kapcsolatos.

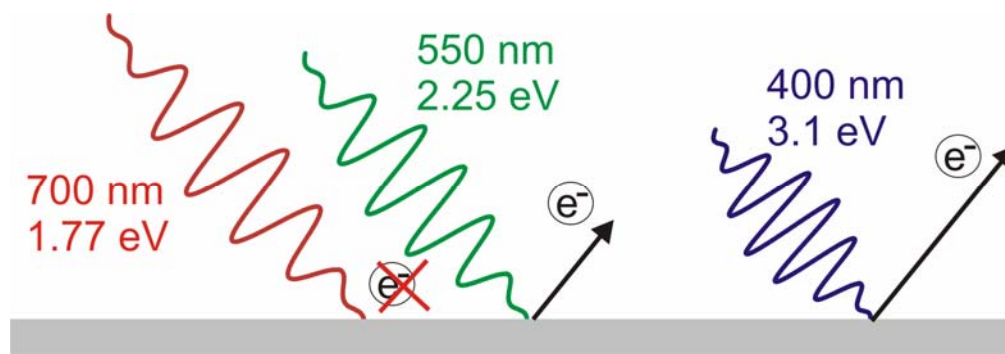
Következmények, alkalmazások: kettős törés, polarizációs mikroszkóp.

Bizonyíték a részecske tulajdonság mellett:

Fotoeffektus

elektron kilépés pl. fémekből fény hatására

(a fény színe érdekes és nem az intenzitása)



$$J = \frac{\Delta E}{\Delta t \Delta A} = \frac{\Delta N \varepsilon}{\Delta t \Delta A}$$

ΔE -t a fotonszám (N) és a fotonenergia (ε) együtt határozza meg

Nem kell sok foton, csak legyen elegendő energiájuk!

$$\varepsilon = hf$$

Sugárzások

példák:

napsugárzás, röntgensugárzás, hangsugárzás, rádiósugárzás,
radioaktív sugárzás

sokfélék

közös tulajdonságuk: **bennük energia terjed**

Fogalmak, jellemző fizikai mennyiségek

a



sugárforrás

b



sugárzás

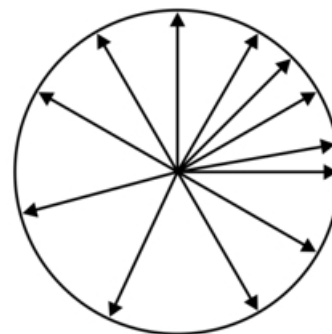
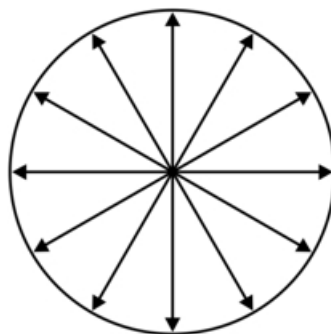
c



besugárzott
test

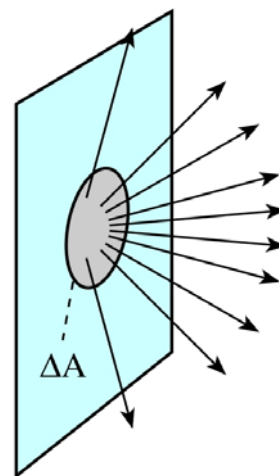
a1.) pontszerű eset (áramvonalak)
kisugárzott **teljesítmény**

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t} \text{ [W]}$$



a2.) kiterjedt eset
kisugárzott **felületi teljesítmény**

$$M = \frac{\Delta E}{\Delta t \Delta A} \left[\frac{\text{W}}{\text{m}^2} \right]$$

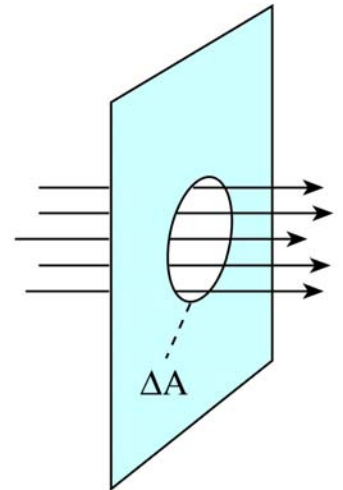


b1.) **energiaáram-erősség** $I_E = \frac{\Delta E}{\Delta t} \text{ [W]}$

b2.) felületre merőleges áramvonalak!

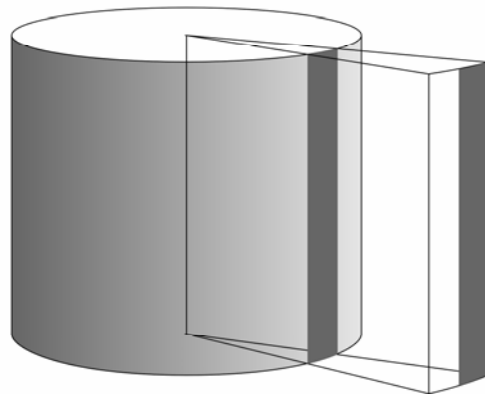
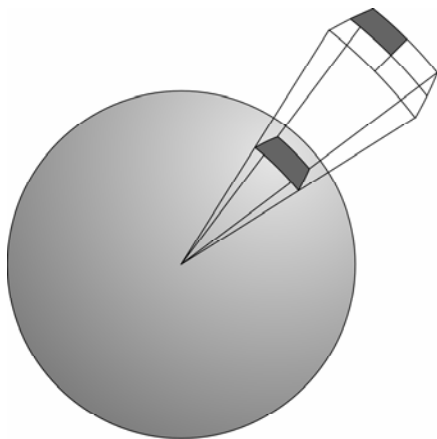
intenzitás (vagy)

energiaáram-sűrűség $J_E = \frac{\Delta E}{\Delta t \Delta A} \left[\frac{\text{W}}{\text{m}^2} \right]$



c.) besugárzott **felületi teljesítmény** M_{be}

Jelenségek, törvények $\left[\frac{\text{W}}{\text{m}^2} \right]$



1.) pontszerű forrásra (gömbszimmetria) (kísérlet)

$$P = M_1 A_1 = M_2 A_2$$

$$\frac{M_1}{M_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2} \quad M \sim 1/r^2$$

2.) vonalszerű forrásra (hengersizimmetria)

$$M \sim 1/r$$

3.) merőleges és ferde beesés

$$M = J \cos \alpha$$